

积层陶瓷电容规格书 编号: RD-SNV0-I0009 A0

系列名称 NV0805N470J102CEDN

0805 COG 47 pF \pm 5 % 1000 V

1.产品简介

汇聚产品使用无铅/镉元素材料制作.

藉由精确的介电材料配制及适当的导电浆料搭配,以及自动化制程的稳定生产和严谨的质量把关,以精确控管了介电设计厚度、电极完整性还有外端电子端极连接的良好特性,实现了最佳可靠度的产品性能.

2. 用途

2.1. 高压耦合/直流阻断

2.5. 直流对直流转换应用

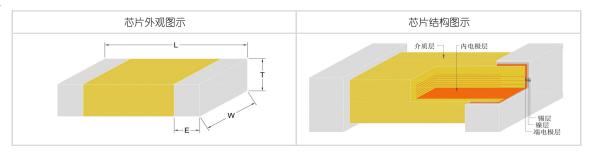
- 2.2. 背光逆变器
- 2.3.LAN/WLAN接□
- 2.4. 调制解调器

3. 型号标示:

NV	0805	N	470	J	102	C	Е	D	N
系列	外型尺寸	介电质	电容量	公差	额定电压	端接类型	包装	厚度	控制码
说明1	说明2	说明3	说明4	说明5	说明6	说明7	说明8	说明9	说明10
说明1		ž.	列		说明6		额定	电压	
NV		一般品 - 高	压,1KV~3KV				1000	V	
说明2		外型	世尺寸		说明7		端接	类型	
L*W*E	2. 10 ± 0.20	1. 25 ± 0.20	0.50 ± 0.20	mm			Cu+l	Ni+Sn	
说明3		介电	质类型		说明8		É	沒	
		C	COG				7 " Reel	卷装-塑带	
说明4		电容量	(Cap)		说明9		Ę	度	
		47	7 pF				1. 25 ± 0.10	mm	
说明5		电容	量公差		说明10		控制	制码	
		±	5 %				无特:	殊需求	
	损	耗角正切 (Tan d	δ) &质量因子	(Q)			绝缘组扩	值 (IR)	
		Q>	1000			IR>100	GΩ或IR*CN≫1	000M Ω *μF,两	者取其小
		温度公差系数	数/容值变化比				操作环	「境温度	
		± 30 ₁	ppm/C				-55^	125℃	
		包装	责数量						
			3 K						

注:以上参数检测条件-测量前参阅"10.2. 预处理"进行预处理,参阅"8. 可靠度检测条件与质量要求"第2点检测。

4. 外型结构





5. 可靠度检测条件与质量要求

项次	项目		检测条件	质量要求		
		温度	15-35℃ (优选25 ±1°C)			
A	环境要求	相对湿度	25%-75%	N/A		
		大气压强	86-106kPa (优选101.3kPa)			
В	恢复条件	参照A项要求				
D		恢复时间	静置6-24h	样品应避免污染导致的测试结果偏差		
	25 AL TO	处理温度	55 ± 2℃			
С		相对湿度	<20%	样品应避免污染导致的测试结果偏差		
C	预处理	处理时间	96 ± 4h	件00)应避光/3架寸以50)测码4条侧左		
		静置时间	在存有合适干燥剂的干燥器中冷却			
D	表面贴装	参阅7.3要求		样品应避免污染导致的测试结果偏差		
1	ØL JM	10倍放大镜下		本体不得有肉眼可见损伤痕迹		
1	外观	10旧放入境下		外型尺寸符合规格标准		
	电容量 (CP)	参照C项进行预处理		电容量公差		
2		在A项环境要求下测量		±5 %		
2		测试频率	1MHz ± 10%			
		测试电压	1.0 ± 0.2 Vrms			
	Q值或损耗角正 切 (DF)	参照C项进行预处理		DF或Q值		
3		在A项环境要求	下测量	Q>1000		
3		测试频率	1MHz ± 10%			
		测试电压	$1.0 \pm 0.2 \text{ Vrms}$			
	温度特性(TCC)	参照C项进行预处理		温度公差系数/容值变化比		
4		操作环境温度	-55 [~] 125℃	± 30ppm/°C		
		参照温度	25℃			
	耐电压 (DWV)	测试电压	1. 2UR			
5		持压时间	1-5sec	无击穿或是闪火现象		
		冲放电流	< 50mA			
	绝缘阻抗 (IR)	测试电压	500 V	应避免污染导致的测试结果偏差		
6		测试时间	120±5s	IR		
		冲放电流	< 50mA	IR>100GΩ或IR*CN>1000MΩ*μF,两者取其小		
	可焊性 -浸焊	加速老化处理	(如需要)			
7		温度	235 ± 5 ℃	整个端头的连续均匀爬锡面积需大于总面积的95%		
		浸渍时间	2±0.5sec			



5. 可靠度检测条件与质量要求

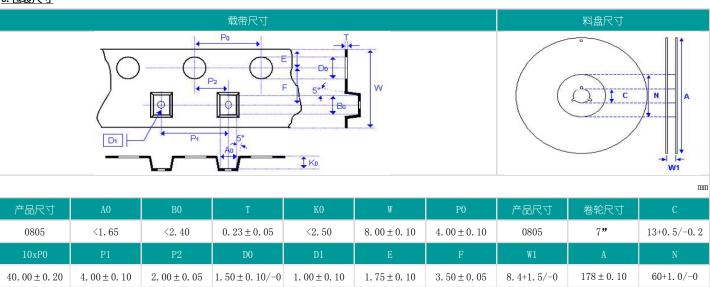
项次	项目	检测条件				质量要求
		参照C项进行预处理		外观	本体不得有肉眼可见损伤痕迹	
	焊接耐热性	预热温度	120-150°C		电容量变化	±5 %
0		预热时间	60sec		DF或Q值	Q>1000
8		温度	260±5°C		IR	IR>100GΩ或IR*CN>1000MΩ*μF,两者取其小
		浸渍时间	10 ±1 sec		耐压	无击穿或是闪火现象
		参照B项恢复后测量				
		参照C项进行预处理			外观	本体不得有肉眼可见损伤痕迹
		参照D项表面贴装		电容量变化	± 2. 5%	
		循环次数	5次		DF或Q值	Q>1000
		步骤	温度(℃)	时间(分钟)	IR	IR>100GΩ或IR*CN>1000MΩ*μF,两者取其小
9	温度循环	1	-55	30	耐压	无击穿或是闪火现象
		2	25±5	<3		
		3	125	30		
		4	25±5	<3		
		参照B项恢复后测量				
		参照C项进行预处理		外观	本体不得有肉眼可见损伤痕迹	
	耐湿性	参照D项表面贴	D项表面贴装		电容量变化	± 5%
10		测试温度	40 ±2° C		DF或Q值	Q>350
		相对湿度	90~95% RH		IR	IR>500MΩ
		测试时间	500+24/-0 h			
		参照B项恢复后	测量			
	高温可靠度	测试温度	125	±2°C	外观	本体不得有肉眼可见损伤痕迹
		测试电压	1. 2UR		电容量变化	± 3%
11		测试时间	1000+48/-0h		DF或Q值	Q>350
		充放电流	< 50mA		IR	IR>1GΩ
		参照B项恢复后测量后测量				
	耐基板弯曲	参照D项表面贴	· 照D项表面贴装		外观	本体不得有肉眼可见损伤痕迹
		压弯深度	1mm		电容量变化	± 5%
		压弯速度	1. 0±0.5mm/s		(电容	量之差异变化量之参考点为板弯零点(未弯曲)数值.)
12		持续时间	5s 下压力			
		基板	50mm 20mm 230mm 25±1mm 45±1mm			



5. 可靠度检测条件与质量要求

项次	项目		检测条件		质量要求		
	端子电极附着 力	参照D项表面贴装		本体不得有肉眼可见损伤痕迹;			
		侧推力度	10N	端电极与陶瓷本体之间接缝处不得有明显的破裂或开裂迹象。			
		维持时间	10 ±1 s				
13		施加位置	两端子之间的中心点				
		MN	RO. 5mm				
	震动测试	参照D项表面贴装		外观	本体不得有肉眼可见损伤痕迹		
14		振动频率	10-55-10Hz/2分钟	电容量变化	± 5 %		
14	辰刈州叫	振幅	1.5mm	DF或Q值	Q>1000		
		时间	6h(X/Y/Z方向各2h)				

6. 包装尺寸

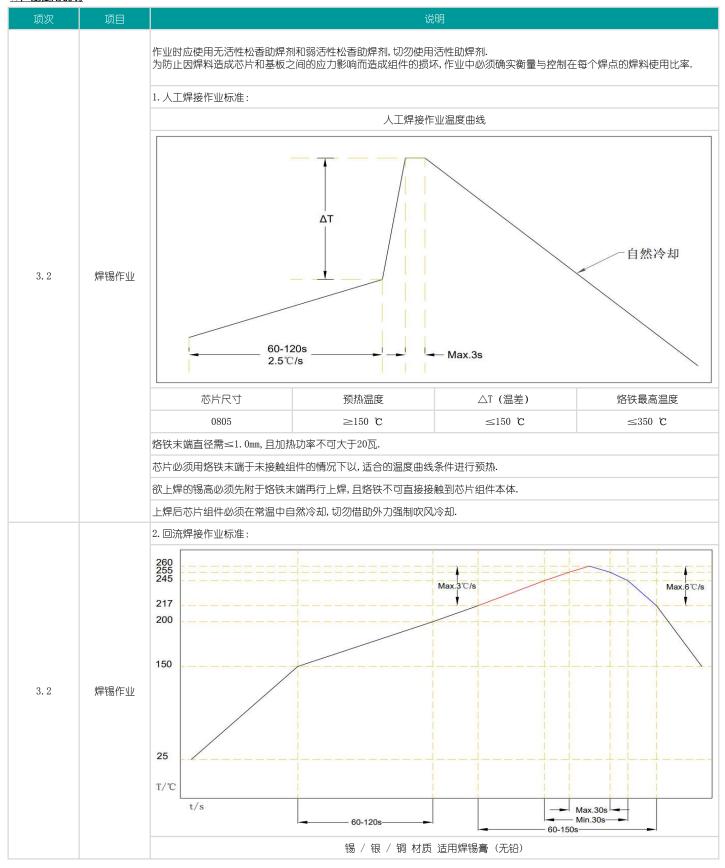


7. 产品使用说明

项次	项目	说明					
	存储	1. 为了避免端子电极可焊性的损害以及老化影响, 建议依循以下条件进行储存置放: 室内环境:温度:5-40℃ / 湿度:20%-70%RH. 并且应避免与含有硫酸,氨气,硫化氢或氯气等酸碱性化学品同时存放.					
1		2. 无需用芯片组件时,不可将包装好之产品拆装. 如果已经拆装并残留有未使用之馀料者, 应尽快在以真空方式进行密封予以保存.					
		3. 卷装包装或散装包装产品皆不可存放具有直接日照曝晒的区域环境之中,这可能会造成包材老化或是胶带附着性能恶化,甚至于产品端子氧化焊性失效可能.					
		4. 产品建议必须自交货后12个月内使用完毕,使用前必须检测可焊性之状况.					
2	使用	陶瓷芯片电容产品材料本质具:高密度/坚硬/易碎/受磨耗之特性,故容易被机械作用所损坏而造成破损或是裂痕.因此组件必须格外小心使用,避免污染或是碰撞损伤.					
2		建议使用真空吸取方式或是塑胶夹具取放组件为恰当. 载带包装好之卷装产品, 较适用于自动化生产作业制程作业.					
3. 1	作业 预热处理	为了降低及避免焊锡作业过程中的温度热冲击影响,控制预热温度条件的考虑是必要的,预热区段的温度升温速度不可大过于3℃为佳.					



7. 产品使用说明





7. 产品使用说明

